

Дифрактометр для исследований переходных процессов в реальном времени на импульсном источнике нейтронов ИБР-2 <i>А. М. Балагуров, А. И. Бескровный, В. В. Журавлев, Г. М. Миронова, И. А. Бобриков, Д. Неов, С. Г. Шеверёв</i>	3
Определение характеристик спектров рассеяния нейтронов на вольфраме с использованием вейвлетов <i>М. А. Горошко, С. Е. Степанов</i>	17
Высококоэрцитивные магнитные зеркала-поляризаторы для тепловых нейтронов <i>Д. А. Татарский, Б. А. Грибков, Н. С. Гусев, В. В. Рогов, П. А. Юнин, С. Н. Вдовичев</i>	23
Рентгеновская рефракционная линза с увеличенной апертурой <i>А. Н. Артемьев, Н. А. Артемьев</i>	27
Применение высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей электронной микроскопии для изучения строения многослойных транзисторных наногетероструктур InAlAs/InGaAs/InAlAs <i>Г. Б. Галиев, Е. А. Климов, Р. М. Имамов, Г. В. Ганин, С. С. Пушкарев, П. П. Мальцев, О. М. Жигалина, А. С. Орехов, А. Л. Васильев, М. Ю. Пресняков, И. Н. Трунькин</i>	32
Рентгеноэлектронное исследование изменения электронной структуры при фазовых переходах в сплавах Co–Ni и Co–Fe <i>И. Н. Шабанова, Н. В. Ломова</i>	48
Электролитно-плазменное насыщение титана и его сплавов легкими элементами <i>П. Н. Белкин, А. М. Борисов, С. А. Кусманов</i>	54
Различные типы фотоактивного поведения ферромагнитного диэлектрика $Y_3Fe_5O_{12}$ <i>Н. В. Воробьева</i>	75
Моделирование вакансионного дефекта на поверхности C(111)- 2×1 <i>О. Ю. Ананьина, Е. В. Северина</i>	81
Формирование тонких мембран анодного оксида алюминия и их использование в качестве матриц при темплатном электроосаждении <i>А. П. Леонтьев, И. В. Росляков, А. С. Веденеев, К. С. Напольский</i>	88
Пробеги легких ионов в средах с разной плотностью <i>Ю. А. Белкова, Я. А. Теплова</i>	95
Влияние захвата и потери двух электронов на зарядовое распределение ионов <i>Н. В. Новиков, Я. А. Теплова</i>	99
Катодолюминесцентные исследования диффузии экситонов в нитриде галлия <i>А. Н. Поляков, М. А. Степович, Д. В. Туртин</i>	104
Особенности определения шероховатости поверхности методом сканирующей зондовой микроскопии <i>В. А. Новиков</i>	109